

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ И ИОНОВ ВБЛИЗИ ПОГЛОЩАЮЩЕГО СФЕРИЧЕСКОГО ТЕЛА В НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ

*А. В. Филиппов\**

*Объединенный институт высоких температур Российской академии наук  
125412, Москва, Россия*

*ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований  
108840, Троицк, Москва, Россия*

Поступила в редакцию 23 сентября 2020 г.,  
после переработки 23 сентября 2020 г.  
Принята к публикации 28 сентября 2020 г.

Исследован вопрос о применимости столкновительной кинетической модели точечных стоков — линеаризованной теории экранирования электрического поля заряженной пылевой частицы, построенной на основе кинетических уравнений Власова для электронов и ионов в неравновесной плазме, дополненных столкновительными членами в форме Бхатнагара–Гросса–Крука и эффективными точечными стоками на пылевые частицы. Критерием применимости столкновительной кинетической модели точечных стоков является малость отклонения концентрации электронов и ионов вблизи поглощающего сферического тела от невозмущенных значений. Проведено сравнение распределений концентрации электронов и ионов, полученных в рамках столкновительной кинетической модели точечных стоков и приближения ограниченных орбит. Показано, что последнее применимо только в пределе низких давлений, а с ростом давления кулоновская асимптотика потенциала, пропорциональная частоте столкновений электронов и ионов с нейтральными атомами (молекулами), делает неприменимыми формулы приближения ограниченных орбит для расчета распределения ионов. Установлено, что область применимости столкновительной кинетической модели точечных стоков близка к области применимости теории Дебая–Гюккеля.

DOI: 10.31857/S0044451021010132

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Кинетическое уравнение Власова широко используется для описания свойств плазмы, когда на первый план выходят коллективные эффекты взаимодействия электронов и ионов в неравновесной плазме [1–6]. Эти уравнения находят применение и при изучении свойств плазмы с частицами конденсированной дисперсной фазы микронных размеров [7–12]. Также сегодня в физике газовых разрядов одно из ведущих мест занимают зондовые методы диагностики плазмы [13–20]. Для определения плавающего потенциала зонда, потенциала поверхности и заряда пылевых частиц широко используется приближение ограниченных орбит (ПОО) (orbit motion limited (OML) approach), которое восходит к рабо-

те Мотт-Смит и Ленгмюра [21]. В работе [22] была создана кинетическая теория сферического зонда в бесстолкновительной плазме и получены выражения для распределения потенциала электрического поля, концентрации электронов и ионов вокруг поглощающего сферического зонда. В работе [23] было показано, что эта теория имеет ограниченную область применимости и при некоторых параметрах плазмы и/или зонда не может правильно описать реакцию плазмы на сферический зонд (пылевую частицу). В работе [24] утверждалось, что в некоторых режимах работы сферического зонда в теории появляются мнимые значения концентрации ионов, для устранения которых авторы предложили модифицировать выражение для определения концентрации ионов из работы [22].

Известно, что ПОО довольно точно предсказывает потенциал поверхности небольших пылевых частиц, несмотря на упрощающее предположение о

\* E-mail: fav@triniti.ru

бесстолкновительном характере движения электронов и ионов. Поэтому исследование границ применимости ПОО важно не только для развития теории зондов, но и для физики пылевой плазмы, которая широко распространена в космосе и в лабораторных условиях [25–32]. Отметим, что сами пылевые частицы могут использоваться для зондирования плазмы [33]. Поэтому настоящая работа посвящена исследованию ограничений ПОО и пределов применимости линеаризованной кинетической теории экранирования электрического поля заряженной пылевой частицы [7, 10].

Работа построена следующим образом. В разд. 2 приводятся выражения для распределений электронов и ионов вокруг сферического зонда при разных характерах изменения распределения потенциала из работы [22]. Далее в разд. 3 приводятся основные уравнения и соотношения столкновительной кинетической модели точечных стоков [7, 10] и в разд. 4 проводится сравнение данных, полученных в рамках различных моделей: ПОО [22], модифицированного ПОО [24] и линеаризованной кинетической теории экранирования на основе уравнений Власова с учетом столкновений и стоков электронов и ионов [7, 10], которую ниже для краткости будем обозначать аббревиатурой ЛКТЭ.

## 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ И ИОНОВ В ПРИБЛИЖЕНИИ ОГРАНИЧЕННЫХ ОРБИТ

Пусть распределение электронов вдали от зонда имеет максвелловский вид. Тогда распределение электронов в отталкивательном поле зонда в отсутствие поглощения описывается распределением Максвелла – Больцмана [22]:

$$n_e(r) = n_{e0} \exp(-\varphi), \quad (1)$$

где  $n_{e0}$  — концентрация электронов в невозмущенной плазме,  $\varphi$  — приведенная потенциальная энергия электрона в поле зонда:  $\varphi = -e\phi(r)/T_e$ ,  $e$  — элементарный заряд,  $r$  — радиальная координата в сферической системе координат с полюсом в центре зонда,  $\phi$  — потенциал электрического поля зонда и плазмы,  $T_e$  — температура электронов в энергетических единицах. При учете поглощения электронов на поверхности зонда радиусом  $a$  в работе [22] получено выражение

$$n_e(r) = \frac{n_{e0}}{2} \left\{ 1 + \operatorname{Erf}(\sqrt{\varphi_0 - \varphi}) + \sqrt{1 - \frac{a^2}{r^2}} \operatorname{Erfc}\left(\sqrt{\frac{\varphi_0 - \varphi}{1 - a^2/r^2}}\right) \times \exp\left[(\varphi_0 - \varphi) \frac{a^2}{r^2 - a^2}\right] \right\} \exp(-\varphi), \quad (2)$$

где  $\varphi_0 = \varphi(r = a) \equiv -e\phi_0/T_e$ ,  $\phi_0$  — электростатический потенциал поверхности зонда,  $\operatorname{Erf}(x)$  — интеграл ошибок [34–36]:

$$\operatorname{Erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad (3)$$

$\operatorname{Erfc}(x)$  — дополнительный интеграл ошибок:  $\operatorname{Erfc}(x) = 1 - \operatorname{Erf}(x)$ .

Далее приведем выражения для расчета распределения концентрации ионов для трех случаев поведения потенциала в окрестности зонда, рассмотренных в работе [22]. Рассматриваем только ионы, совершающие инфинитное движение, так как для появления совершающих финитное движение ионов нужно включить столкновения или рассмотреть нестационарную задачу зарядки изолированного зонда (пылевой частицы), что является отдельной задачей. В работе [22] рассмотрен вопрос о совершающих в притягивающем центре положительно заряженного зонда финитное движение электронах при преобладании столкновений с нейтральными атомами (молекулами) газа с учетом большой разницы масс электрона и атомов. В настоящей работе рассматривается случай отрицательно заряженной пылевой частицы, при этом финитное движение могут совершать только положительные ионы, чья масса сравнима с массой атомов или молекул газа. Для такого случая нет аналитической теории для описания совершающих финитное движение ионов (см., например, работы [37–40]; в работе [39] в предположении максвелловского распределения получено выражение для расчета концентрации захваченных ионов, которое содержит неопределенный множитель).

### 2.1. Случай 1

В этом самом простом случае потенциал ведет себя как  $|e\phi(r)| \sim 1/r^{2-\delta}$ ,  $\delta > 0$ , и распределение ионов, совершающих инфинитное движение, в притягивающем поле без учета поглощения зондом определяется выражением [22]

$$n_i(r) = n_{i0} \left[ \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{z\beta\varphi} + e^{z\beta\varphi} \operatorname{Erfc}\left(\sqrt{z\beta\varphi}\right) \right], \quad (4)$$

а с учетом поглощения — выражением

$$n_i(r) = n_{i0} \left\{ \sqrt{\frac{z\beta\varphi}{\pi}} \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{a^2}{r^2} \frac{\varphi_0}{\varphi}} \right] + \frac{1}{2} e^{z\beta\varphi} \operatorname{Erfc}(\sqrt{z\beta\varphi}) + \frac{\sqrt{1 - a^2/r^2}}{2} e^{z\beta\tilde{\varphi}} \operatorname{Erfc}(\sqrt{z\beta\tilde{\varphi}}) \right\}, \quad (5)$$

где  $z$  — зарядовое число ионов,  $\tilde{\varphi} = (\varphi - \varphi_0 a^2/r^2) / (1 - a^2/r^2)$ ,  $n_{i0}$  — концентрация ионов в невозмущенной плазме,  $\beta = T_e/T_i$ ,  $T_i$  — температура ионов в энергетических единицах. Отметим, что в случае 1 на всех расстояниях выполнено условие

$$\frac{r^2\varphi(r)}{a^2} = \varphi_0 \left(\frac{r}{a}\right)^\delta \geq \varphi_0, \quad (6)$$

поэтому появление мнимых значений концентрации ионов невозможно, они появились в работе [24] только из-за использования выражения (5) вне пределов его применимости. Если условие (6) нарушено, то реализуется случай 2 или 3 [22], для которых распределение концентрации ионов описывается уже совсем другими формулами. Поэтому утверждение авторов [24] о несостоятельности приближения ограниченных орбит (OML) для описания сферического зонда по этой причине ошибочно.

### 2.2. Случай 2

В этом случае  $|e\phi(r)| \sim 1/r^{2-\delta}$  при малых и  $|e\phi(r)| \sim 1/r^{2+\epsilon}$  при больших расстояниях  $r$  от центра зонда ( $\delta > 0$ ,  $\epsilon > 0$ ). Для этого случая без учета поглощения ионов в работе [22] получено соотношение

$$n_i(r) = n_{i0} \left[ e^{z\beta\varphi} \operatorname{Erfc}(\sqrt{z\beta\varphi}) + I(r, \infty) \right], \quad (7)$$

где  $I(r, b)$  — интеграл, определенный выражением

$$I(r, b) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{z\beta}{\pi}} \int_{\varrho_0(r)}^b \frac{(r_0^2/r^2 - 1) \left( 3 \frac{d\varphi}{dr_0} + r_0 \frac{d^2\varphi}{dr_0^2} \right)}{[F(r, r_0)]^{1/2}} \times \exp \left[ z\beta \left( \varphi(r_0) + \frac{r_0}{2} \frac{d\varphi(r_0)}{dr_0} \right) \right] dr_0, \quad (8)$$

$$F(r, r_0) = \varphi(r) - \varphi(r_0) + \frac{r_0}{2} \frac{d\varphi}{dr_0} \left( \frac{r_0^2}{r^2} - 1 \right), \quad (9)$$

$\varrho_0$  — максимальный корень уравнения

$$\varphi(\varrho_0) - \varphi(r) - \frac{\varrho_0}{2} \frac{d\varphi}{dr} \Big|_{r=\varrho_0} \left( \frac{\varrho_0^2}{r^2} - 1 \right) = 0. \quad (10)$$

Отметим, что в выражении (7) производные приведенного потенциала по  $r_0$  понимаются в следующем смысле:

$$\frac{d\varphi}{dr_0} = \frac{d\varphi}{dr} \Big|_{r=r_0}, \quad \frac{d^2\varphi}{dr_0^2} = \frac{d^2\varphi}{dr^2} \Big|_{r=r_0}.$$

Здесь  $r_0$  — параметр, который определяет проекции скорости иона:

$$v_r^2 = \frac{2ez}{m_i} [\phi(r_0) - \phi(r)] - \frac{r_0 ez}{m_i} \frac{d\phi}{dr} \Big|_{r=r_0} \left( \frac{r_0^2}{r^2} - 1 \right), \quad (11)$$

$$v_\theta^2 = \frac{ezr_0^2}{m_i r^2} \frac{d\phi}{dr} \Big|_{r=r_0},$$

$m_i$  — масса ионов.

При учете поглощения ионов зондом для  $n_i$  имеет место выражение [22]

$$n_i(r) = \frac{1}{2} n_{i0} \left\{ e^{z\beta\varphi} \operatorname{Erfc}(\sqrt{z\beta\varphi}) + \sqrt{1 - \frac{a^2}{r^2}} \times \operatorname{Erfc} \left( \sqrt{-\frac{z\beta\varrho_0^3(a)}{2a^2} \frac{d\varphi}{dr} \Big|_{r=\varrho_0(a)} - \frac{z\beta[\varphi_0 - \varphi(r)]}{1 - a^2/r^2}} \right) \times \exp \left[ -z\beta \frac{a^2\varphi_0 - r^2\varphi(r)}{r^2 - a^2} \right] + I(r, \varrho_0(a)) + I(r, \infty) \right\}. \quad (12)$$

Отметим, что функция  $F(r, r_0)$  не отрицательна в силу определения  $\varrho_0$  (см. выражение (10)), а в точке  $r_0 = \varrho_0$  обращается в нуль. Поэтому выражение (8) неудобно для численного интегрирования. С учетом того, что в числителе дроби в (8) стоит величина  $\partial F(r, r_0) / \partial r_0$ , после интегрирования по частям получим

$$I(r, b) = \sqrt{\frac{z\beta}{\pi}} \left\{ 2\sqrt{F(r, b)} \times \exp \left[ z\beta \left( \varphi(b) + \frac{b}{2} \frac{d\varphi}{dr_0} \Big|_{r_0=b} \right) \right] - z\beta \int_{\varrho_0(r)}^b \sqrt{F(r, r_0)} \left( 3 \frac{d\varphi}{dr_0} + r_0 \frac{d^2\varphi}{dr_0^2} \right) \times \exp \left[ z\beta \left( \varphi(r_0) + \frac{r_0}{2} \frac{d\varphi}{dr_0} \right) \right] dr_0 \right\}. \quad (13)$$

Отметим, что в случаях 2 и 3 (см. ниже) первый член в выражении (13) при  $b = \infty$  переходит в  $\sqrt{4z\beta\varphi(r)}/\pi$ .

Максимальный корень  $\varrho_0$  уравнения (10) всегда больше  $r_k$  — корня уравнения

$$3 \left. \frac{d\varphi}{dr} \right|_{r_k} + r_k \left. \frac{d^2\varphi}{dr^2} \right|_{r_k} = 0. \quad (14)$$

Например, для дебаевского потенциала (поведение которого полностью соответствует случаю 2)

$$\phi(r) = \frac{\phi_0 a}{r} e^{-(r-a)/R_D}, \quad (15)$$

решая уравнение (14), находим

$$r_k = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} R_D.$$

Здесь  $R_D$  — дебаевский радиус экранирования. Следовательно, во всей области изменения параметра  $r_0$  приведенный потенциал  $\varphi(r_0)$  в интеграле (8) или (13) уменьшается с ростом  $r_0$  быстрее, чем  $1/r_0^2$ , т. е. всегда

$$\varphi(r_0) + \frac{r_0}{2} \frac{d\varphi(r_0)}{dr_0} < 0$$

и экспоненциальный член меньше единицы. Отметим, что при выполнении неравенства

$$a \ll r_k \quad (16)$$

выражение (12) переходит в (5), при  $a/r \rightarrow 0$  (12) совпадает с (7), а при  $r \rightarrow a$  из-за наличия поглощающей поверхности концентрация ионов уменьшится вдвое.

### 2.3. Случай 3

Этот случай отличается от случая 2 тем, что при  $r \rightarrow \infty$  потенциал убывает строго по закону  $1/r^2$ , т. е. на больших расстояниях ведет себя как

$$ez\phi(r) = -\frac{C}{r^2} \equiv -\frac{C_0 T_i a^2}{r^2} \quad (17)$$

(постоянные  $C$  и  $C_0$  положительны). Без учета поглощения в этом случае к выражению (7) прибавится член

$$\Delta n_i(r) = \frac{2n_{i0}}{\sqrt{\pi}} \left[ \sqrt{z\beta\varphi} - \sqrt{z\beta\varphi - C_0 \frac{a^2}{r^2}} \right], \quad (18)$$

а при учете поглощения поправка к выражению (12) при  $a > a_k(r)$  имеет вид

$$\Delta n_i(r) = \frac{n_{i0}}{\sqrt{\pi}} \left[ \sqrt{z\beta\varphi} - \sqrt{z\beta\varphi - C_0 \frac{a^2}{r^2}} \right], \quad (19)$$

при  $a < a_k(r)$  —

$$\begin{aligned} \Delta n_i(r) = & \frac{n_{i0}}{2} \left\{ \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left[ \sqrt{z\beta\varphi} + \sqrt{z\beta\varphi - z\beta\varphi_0 \frac{a^2}{r^2}} - \right. \right. \\ & \left. \left. - 2\sqrt{z\beta\varphi - C_0 \frac{a^2}{r^2}} \right] + \sqrt{1 - \frac{a^2}{r^2}} \times \right. \\ & \times \left[ \operatorname{Erf} \left( \sqrt{-\frac{z\beta\varrho_0^3(a)}{2a^2} \frac{d\varphi}{dr} \Big|_{r=\varrho_0(a)} - \frac{z\beta[\varphi_0 - \varphi(r)]}{1 - a^2/r^2}} \right) - \right. \\ & \left. - \operatorname{Erf} \left( \sqrt{z\beta \frac{r^2\varphi(r) - a^2\varphi_0}{r^2 - a^2}} \right) \right] \times \\ & \left. \times \exp \left[ z\beta \frac{r^2\varphi(r) - a^2\varphi_0}{r^2 - a^2} \right] \right\}. \quad (20) \end{aligned}$$

Здесь  $a_k(r)$  — критический радиус, определяемый из уравнения

$$-\phi(a_k) + \phi(r) + \frac{r}{2} \frac{d\phi}{dr} \left( 1 - \frac{r^2}{a_k^2} \right) = 0 \quad (21)$$

(при  $a > a_k$  становится важной кривая, разделяющая частицы, точки поворота которых находятся в ближней и дальней от центра зонда или пылевой частицы областях).

### 2.4. Модифицированное распределение ионов

В работе [24] предлагалось исправить выражение (5) следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{n_i(r)}{n_{i0}} = & \sqrt{\frac{z\beta\varphi}{\pi}} + \frac{1}{2} e^{z\beta\varphi} \operatorname{Erfc} \left( \sqrt{z\beta\varphi} \right) + \\ & + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{a^2}{r^2}} e^{z\beta\tilde{\varphi}} + \left[ \sqrt{\frac{z\beta}{\pi}} \sqrt{\frac{r^2\varphi - a^2\varphi_0}{r^2}} - \right. \\ & \left. - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{a^2}{r^2}} e^{z\beta\tilde{\varphi}} \operatorname{Erf} \left( \sqrt{z\beta\tilde{\varphi}} \right) \right] \theta(\tilde{\varphi}), \quad (22) \end{aligned}$$

где  $\tilde{\varphi} = (r^2\varphi - a^2\varphi_0) / (r^2 - a^2)$ ,  $\theta(x)$  — ступенчатая функция Хевисайда:  $\theta(x) = 1$ , если  $x > 0$ , и 0, если  $x < 0$ . Отметим, что выражение (22) было получено уже в работе [39]. Это выражение справедливо только в случае, если нет барьера при движении иона из бесконечности к поверхности зонда, т. е. при поведении потенциала, как в случае 1. Как отмечалось выше, в этом случае величина  $\tilde{\varphi}$  строго положительна. Выражение (22) можно применять в случаях 2 и 3, когда количество ионов, для которых существует барьер, мало. Но такие ионы, как отмечалось в работе [23], при максвелловской функции распределения есть всегда, поэтому точность этой формулы требует отдельного исследования.

### 3. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭКРАНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ ВЛАСОВА С УЧЕТОМ СТОЛКНОВЕНИЙ И СТОКОВ ЭЛЕКТРОНОВ И ИОНОВ

Для проверки полученных выражений для распределения концентраций электронов и ионов рассмотрим задачу на основе подхода в рамках ЛКТЭ [7, 8]. В этих работах для стационарных поправок к невозмущенным функциям распределения получено выражение

$$\begin{aligned} \delta f_{\sigma, \mathbf{k}}(\mathbf{v}) = & \phi_{\mathbf{k}} \frac{e_{\sigma}}{m_{\sigma}} \frac{\partial f_{\sigma 0}(\mathbf{v})}{\partial \mathbf{v}} \frac{\mathbf{k}}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} - i\nu_{\sigma}} + \frac{i S_{\sigma}^{(0)}(\mathbf{v})}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} - i\nu_{\sigma}} - \\ & - i \mathbf{k} \phi_{\mathbf{k}} \frac{e_{\sigma}}{m_{\sigma}} \frac{\nu_{\sigma} \Phi_{\sigma}(\mathbf{v})}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} - i\nu_{\sigma}} \frac{1}{1 + I_{\Phi\sigma}(k)} \int \frac{1}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}' - i\nu_{\sigma}} \times \\ & \times \frac{\partial f_{\sigma 0}(\mathbf{v}')}{\partial \mathbf{v}'} d\mathbf{v}' + \frac{\nu_{\sigma} \Phi_{\sigma}(\mathbf{v})}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} - i\nu_{\sigma}} \frac{1}{1 + I_{\Phi\sigma}(k)} \times \\ & \times \int \frac{S_{\sigma}^{(0)}(\mathbf{v}')}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}' - i\nu_{\sigma}} d\mathbf{v}', \quad (23) \end{aligned}$$

где  $\sigma$  обозначает электроны ( $\sigma = e$ ) или ионы ( $\sigma = i$ ),  $e_{\sigma}$ ,  $m_{\sigma}$  — заряд и масса  $\sigma$ -частиц плазмы соответственно,  $e_e = -e$ ,  $e_i = ze$ ,  $\mathbf{v}$  — вектор скорости электронов или ионов,  $f_{\sigma 0}$  — невозмущенные функции распределения, нормированные условием

$$\int f_{\sigma 0}(\mathbf{v}) d\mathbf{v} = 1,$$

$\nu_{\sigma}$  — частота столкновений электронов и ионов с атомами буферного газа,  $S_{\sigma}^{(0)}(\mathbf{v})$  — стационарный сток частиц  $\sigma$ -компоненты плазмы на макрочастицу:

$$S_{\sigma}^{(0)}(\mathbf{v}) = \nu_{\sigma} \sigma (q_0, v) f_{\sigma 0}(\mathbf{v}), \quad (24)$$

$\sigma_{\sigma}(q, v)$  — сечения зарядки, которые зависят от свойств окружающей плазмы,  $q_0 = q(t = \infty)$  — стационарный заряд макрочастицы,  $\Phi_{\sigma}(\mathbf{v})$  — функция распределения  $\sigma$ -частиц плазмы, формирующаяся в результате столкновений с нейтральными атомами,  $I_{\Phi\sigma}(k)$  — интеграл, определенный выражением

$$\begin{aligned} I_{\Phi\sigma}(k) = & i\nu_{\sigma} \int \frac{\Phi_{\sigma}}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} - i\nu_{\sigma}} d\mathbf{v} \equiv \\ \equiv & -\frac{4\pi}{k} \int_0^{\infty} \Phi_{\sigma} \nu_{\sigma} \operatorname{arctg}\left(\frac{kv}{\nu_{\sigma}}\right) v dv. \quad (25) \end{aligned}$$

В случае, когда  $\Phi_{\sigma}$  является максвелловской функцией с температурой  $T_{\sigma}$ , последний интеграл равен

$$\begin{aligned} I_{\Phi\sigma}(k) = & -(\pi)^{1/2} \frac{k\nu_{\sigma}}{k} \operatorname{Erfc}\left(\frac{k\nu_{\sigma}}{k}\right) \exp\left(\frac{k^2\nu_{\sigma}^2}{k^2}\right), \quad (26) \\ k\nu_{\sigma} = & \nu_{\sigma} \sqrt{\frac{m_{\sigma}}{2T_{\sigma}}}. \end{aligned}$$

После интегрирования (23) по  $d\mathbf{v}$  с максвелловскими функциями распределения в работах [7, 10] найдено

$$\begin{aligned} \delta n_{\sigma, \mathbf{k}} \equiv & n_{\sigma 0} \int \delta f_{\sigma, \mathbf{k}}(\mathbf{v}) d\mathbf{v} = \\ = & -\phi_{\mathbf{k}} \frac{e_{\sigma} n_{\sigma 0}}{T_{\sigma}} + \frac{I_{S\sigma}(k)}{1 + I_{\Phi\sigma}(k)} n_{\sigma 0}, \quad (27) \end{aligned}$$

где интеграл  $I_{S\sigma}(k)$  определен выражением

$$\begin{aligned} I_{S\sigma}(k) = & i \int \frac{S_{\sigma}^{(0)}(\mathbf{v})}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v} - i\nu_{\sigma}} d\mathbf{v} = \\ = & -\frac{4\pi}{k} \int_0^{\infty} f_{\sigma 0} \nu_{\sigma} \operatorname{arctg}\left(\frac{kv}{\nu_{\sigma}}\right) v^2 dv. \quad (28) \end{aligned}$$

Из выражения (27) следует, что возмущения концентраций заряженных частиц плазмы вызваны как электрическим полем заряженной макрочастицы, так и стоками электронов и ионов на макрочастицу.

В стационарном режиме для фурье-образа потенциала в случае максвелловских функций распределения имеем [7, 10]

$$\phi_{\mathbf{k}} = \frac{4\pi e q_0}{k^2 + k_D^2} + \frac{4\pi}{k^2 + k_D^2} \sum_{\sigma} e_{\sigma} n_{\sigma 0} \frac{I_{S\sigma}}{1 + I_{\Phi\sigma}}, \quad (29)$$

где  $k_D$  — постоянная экранирования:  $k_D^2 = \sum_{\sigma} k_{D\sigma}^2$ ,  $k_{D\sigma}$  — постоянная экранирования  $\sigma$ -компоненты плазмы:

$$k_{D\sigma}^2 = \frac{4\pi e_{\sigma}^2 n_{\sigma 0}}{T_{\sigma}}.$$

После обратного фурье-преобразования (27) и (29) для стационарного распределения потенциала и возмущений концентрации частиц плазмы находим

$$\begin{aligned} \phi(r) = & \frac{q_0 e^{-k_D r}}{r} + \frac{2}{\pi r} \sum_{\sigma} e_{\sigma} n_{\sigma 0} \int \frac{I_{S\sigma}(k)}{1 + I_{\Phi\sigma}(k)} \times \\ & \times \frac{\sin(kr)}{k^2 + k_D^2} k dk, \quad (30) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta n_{\sigma}(r) = & -n_{\sigma 0} \frac{e_{\sigma} \phi(r)}{T_{\sigma}} + \frac{n_{\sigma 0}}{2\pi^2 r} \times \\ & \times \int \frac{I_{S\sigma}(k)}{1 + I_{\Phi\sigma}(k)} \sin(kr) k dk. \quad (31) \end{aligned}$$

Первый член в правой части выражения (31) есть просто линейный член разложения распределения Больцмана, а второй член обусловлен стоком  $\sigma$ -частиц плазмы на макрочастицу.

При численном интегрировании (30) и особенно (31) возникают трудности, связанные с тем, что функции

$$F_\sigma(k) = \frac{I_{S_\sigma}(k)}{1 + I_{\Phi_\sigma}}$$

при больших  $k$  имеют асимптотики вида

$$F_\sigma(k) \asymp F_{\sigma,as}(k) = \frac{a_\sigma}{k} + \frac{b_\sigma}{k^2}. \quad (32)$$

Поэтому в численных расчетах по массивам данных  $F_\sigma(k)$  при больших  $k$  методом наименьших квадратов находились коэффициенты  $a_\sigma$  и  $b_\sigma$ , затем из  $F_\sigma(k)$  вычиталась  $F_{\sigma,as}(k)$  и проводилось быстрое фурье-преобразование. Затем к полученному результату добавлялись асимптотические распределения потенциала и концентраций:

$$\begin{aligned} \phi_{as}(r) &\equiv \frac{2}{\pi r} \sum_\sigma e_\sigma n_\sigma \int \frac{F_{\sigma,as}(k)}{k^2 + k_D^2} \sin(kr) k dk = \\ &= \frac{\tilde{e}Q_{as}}{r} g(k_D r) + \frac{eQ_{as}}{r} (1 - e^{-k_D r}), \quad (33) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n_{\sigma,as}(r) &\equiv \frac{n_{\sigma 0}}{2\pi^2 r} \int F_{\sigma,as}(k) \sin(kr) k dk = \\ &= \frac{n_{\sigma 0}}{2\pi^2 r} \left( \frac{a_\sigma}{r} + \frac{\pi}{2} b_\sigma \right), \quad (34) \end{aligned}$$

где  $\tilde{Q}_{as} = \sum_\sigma \tilde{Q}_{\sigma,as}$ ,  $Q_{as} = \sum_\sigma Q_{\sigma,as}$ ,  $g(k_D r) = e^{-k_D r} \text{Ei}(k_D r) + e^{k_D r} \text{E}_1(k_D r)$ ,  $\text{Ei}(x)$ ,  $\text{E}_1(x)$  — интегральные показательные функции, асимптотические заряды определены выражениями

$$\tilde{Q}_{\sigma,as} = \frac{a_\sigma e_\sigma n_\sigma}{\pi e k_D}, \quad Q_{\sigma,as} = \frac{b_\sigma e_\sigma n_\sigma}{e k_D^2}.$$

С учетом того, что при  $x \rightarrow \infty$  функция  $g(x) \rightarrow 2/x$ , из (33) и (17) находим

$$C_0 = -\frac{2e^2 z (\tilde{Q}_{e,as} + \tilde{Q}_{i,as})}{T_i k_D a^2}. \quad (35)$$

#### 4. СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

В случае зондовых измерений потенциал зонда может быть произвольным, но в случае макрочастицы в плазме потенциал ее поверхности определяется равенством потоков электронов и ионов на нее:

$$S_e = S_i, \quad (36)$$

где

$$S_\sigma = n_{\sigma 0} \int S_\sigma^{(0)}(v) d\mathbf{v} = n_{\sigma 0} \int \sigma_\sigma(\phi_0, v) f_{\sigma 0}(\mathbf{v}) d\mathbf{v},$$

$\sigma_\sigma(\phi_0, v)$  — сечения зарядки, которые зависят от свойств окружающей плазмы. В качестве сечения зарядки мы будем использовать сечения поглощения в приближении ограниченных орбит [21]:

$$\sigma_\sigma(u) = \pi r_0^2 \begin{cases} 1 - \frac{2e_\sigma \phi_0}{m_\sigma u^2}, & u^2 > 2e_\sigma \phi_0 / m_\sigma, \\ 0, & u^2 < 2e_\sigma \phi_0 / m_\sigma. \end{cases} \quad (37)$$

Можно также учесть влияние столкновений на сечения поглощения ионов (см., например, работы [41–48]).

Используя сечения (37), в случае максвелловских функций распределения для потоков находим

$$\begin{aligned} S_e &= \pi r_0^2 n_{e0} \sqrt{\frac{8T_e}{\pi m_e}} \exp\left(\frac{e\phi_0}{T_e}\right), \\ S_i &= \pi r_0^2 z n_{i0} \sqrt{\frac{8T_i}{\pi m_i}} \left(1 - \frac{ez\phi_0}{T_i}\right). \end{aligned} \quad (38)$$

Выражения (38) не учитывают ионы, совершающие финитное движение вокруг зонда с отрицательным потенциалом, а также выражение для  $S_i$  справедливо только при поведении потенциала, описываемом случаем 1. Если поведение потенциала относится к случаю 2 или 3, то поток ионов на зонд уже зависит от всего хода потенциала, а не только от  $\phi_0$ , и определяется выражением [22]

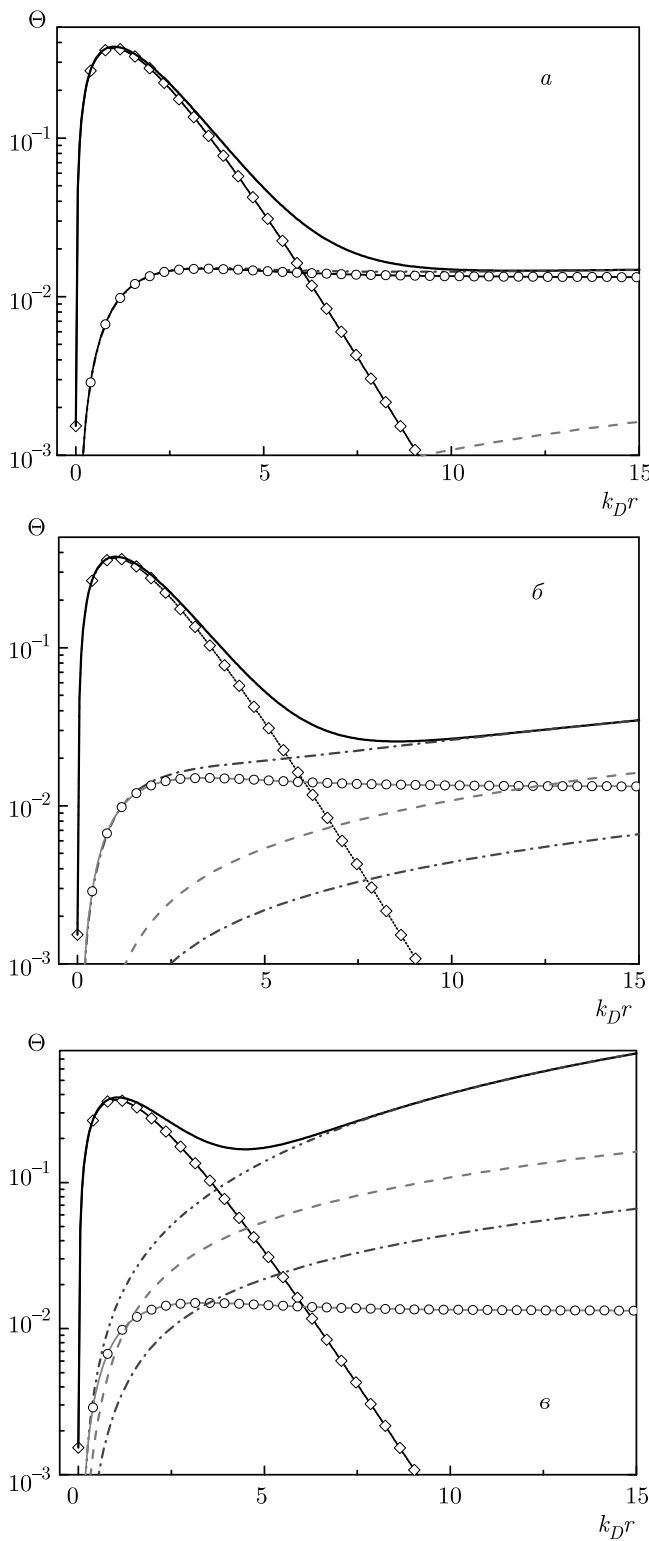
$$\begin{aligned} S_i &= \pi r_0^2 z n_{i0} \sqrt{\frac{8T_i}{\pi m_i}} \left\{ C_0 + \frac{\varrho_0^2(a)}{a^2} - \left[ \frac{\varrho_0^2(a)}{a^2} - 1 \right] \times \right. \\ &\times \exp \left[ z\beta\varphi(\varrho_0|_{r=a}) + \frac{z\beta\varrho_0(a)}{2} \frac{d\varphi}{dr} \Big|_{r=\varrho_0(a)} \right] + \\ &+ \int_{\varrho_0(a)}^\infty r_0 \left[ 1 - \exp \left( z\beta\varphi(r_0) + \frac{r_0 z\beta}{2} \times \right. \right. \\ &\left. \left. \times \frac{d\varphi(r_0)}{dr_0} \right) \right] dr_0 \left. \right\}. \quad (39) \end{aligned}$$

(В случае 2, напомним,  $C_0 = 0$ .) Здесь мы самосогласованную задачу не решаем, поэтому потенциал поверхности зонда определяется с использованием формулы (38) для потока ионов.

Если всюду в области  $r_0 > \varrho_0(a)$  выполнено условие

$$\varphi(r_0) + \frac{r_0}{2} \frac{d\varphi(r_0)}{dr_0} \ll \frac{1}{z\beta}, \quad (40)$$

то выражение (39) переходит во второе выражение (38).



**Рис. 1.** Распределение приведенного потенциала  $\Theta(r) = k_D r^2 \phi(r) / \phi_0$  самосогласованного электрического поля вокруг макрочастицы радиусом 1 мкм в изотермической плазме при  $E/N = 1$  Тд, давлениях 0.1 Па (а), 1 Па (б) и 10 Па (в) в аргоне: сплошные кривые — полный потенциал (30), ромбы — дебаевский потенциал (42), штрихпунктирные кривые с двумя точками — полный потенциал (30) без дебаевского вклада, кружки —  $\phi_g(r)$  (43), штриховые кривые —  $\phi_Q(r)$ , штрихпунктирные кривые —  $\phi_S(r)$  (49)

На рис. 1 представлены распределения приведенного потенциала  $\Theta(r) = k_D r^2 \phi(r) / \phi_0$  в аргоне при  $E_{dis}/N = 1$  Тд при трех разных давлениях и, соответственно, разных частотах столкновений, найденные из выражения (30) путем быстрого фурье-преобразования. В расчетах использовались равномерные сетки по  $k$  и  $r$  в основном из  $N = 2^{16}$  точек при максимальном значении волнового числа  $k_{max} = 2^{11} k_D$  и максимальном значении радиальной координаты  $R_{max} = \pi N / k_{max} = 32 \pi R_D$ . Концентрации электронов и ионов задавались, как и в работе [10], следующими:  $n_{e0} = n_{i0} = 10^9 \text{ см}^{-3}$  ( $z_i = 1$ ), радиус пылевой частицы  $a = 1$  мкм, температура ионов  $T_i = 0.026$  эВ (300 К). Температура электронов задавалась соответствующей приведенной напряженности электрического поля  $E/N$ , равной  $10^{-4}$  и 1 Тд (более подробно см. работу [10]).

В изотермической плазме ( $T_e \approx T_i = 0.026$  эВ) распределения потенциала имели практически такой же вид, отличаясь только мелкими деталями. Интегралы  $I_{S\sigma}$  (28) вычислялись методом трапеций с адаптивным выбором шага для достижения заданной относительной точности, равной  $10^{-6}$ .

Из рис. 1 видно, что величина  $\Theta(r)$  при давлении 0.1 Па проходит через максимум, а на больших расстояниях принимает постоянное значение, поэтому распределение потенциала при этом давлении относится к случаю 3. Такая же картина при этом давлении наблюдалась и в других инертных газах. С ростом давления на больших расстояниях величина  $\Theta(r)$  начинает расти, что связано с вкладом потенциала  $\phi_Q$  (см. ниже выражение (44)), убывающего как  $1/r$ . Это приводит к тому, что интеграл (8) при  $b = \infty$  и интеграл в выражении для стока ионов (39) становятся расходящимися. Поэтому поведение потенциала уже при давлении газа 1 Па не описывается ни одним из рассмотренных в работе [22] случаев.

На рис. 1 также приведены распределения потенциала согласно аналитическому выражению [10]

$$\phi(r) = \phi_D(r) + \phi_g(r) + \phi_Q(r), \quad (41)$$

где  $\phi_D$  — дебаевский потенциал ( $q_0$  — заряд пылевой частицы):

$$\phi_D(r) = \frac{eq_0 e^{-k_D r}}{r}, \quad (42)$$

$\phi_g$  — обусловленная стоками электронов и ионов на пылевую частицу часть потенциала в бесстолкновительном пределе:

$$\phi_g(r) = -\frac{\sum e\tilde{Q}_\sigma}{r} g(k_D r), \quad (43)$$

$\phi_Q$  — обусловленная столкновениями электронов и ионов с нейтральными атомами часть потенциала:

$$\phi_Q(r) = -\frac{e \sum Q_\sigma}{r} (1 - e^{-k_D r}). \quad (44)$$

Здесь  $\tilde{Q}_\sigma$  и  $Q_\sigma$  — эффективные заряды, определенные выражениями

$$\tilde{Q}_\sigma = \frac{2\pi z_\sigma n_{\sigma 0}}{k_D} \int_0^\infty f_{\sigma 0} \sigma_\sigma v^2 dv, \quad (45)$$

$$Q_\sigma = \frac{\pi \nu_\sigma}{k_D} \sqrt{\frac{\pi m_\sigma}{2T_\sigma}} \tilde{Q}_\sigma. \quad (46)$$

При выполнении условия  $k_D a \ll 1$  для нахождения заряда макрочастицы можно использовать вакуумную связь с потенциалом поверхности:  $eq_0 = \phi_0 a$ , в случае дебаевского экранирования нужно использовать формулу  $eq_0 = \phi_0 a (1 + k_D a)$ .

При интегрировании с максвелловскими функциями распределения в работе [10] получены выражения

$$\begin{aligned} \tilde{Q}_i &= \frac{z_i n_{i0} \pi r_0^2}{2k_D} \left( 1 - \frac{2ez_i \phi_0}{T_i} \right), \\ \tilde{Q}_e &= \frac{z_e n_{e0} \pi r_0^2}{2k_D} \left[ \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{-\frac{e\phi_0}{T_e}} \exp\left(\frac{e\phi_0}{T_e}\right) + \right. \\ &\quad \left. + \left( 1 + \frac{2e\phi_0}{T_e} \right) \operatorname{erfc}\left(\sqrt{-\frac{e\phi_0}{T_e}}\right) \right]. \end{aligned} \quad (47)$$

При давлении 0.1 Па значение эффективного заряда  $Q_i$  ( $Q_e \ll Q_i$ ), связанного со столкновениями, мало, поэтому (41) практически совпадает с суммой дебаевского потенциала (42) и потенциала (43). Отметим, что потенциал (43) на больших расстояниях  $k_D r \gg 1$  выходит на асимптотику:

$$\phi_g(r) \simeq -\frac{2e(\tilde{Q}_e + \tilde{Q}_i)}{k_D r^2}. \quad (48)$$

Поэтому при определении величины  $C_0$  в выражении (41) вместо  $\tilde{Q}_{e,as}$  и  $\tilde{Q}_{i,as}$  можно использовать

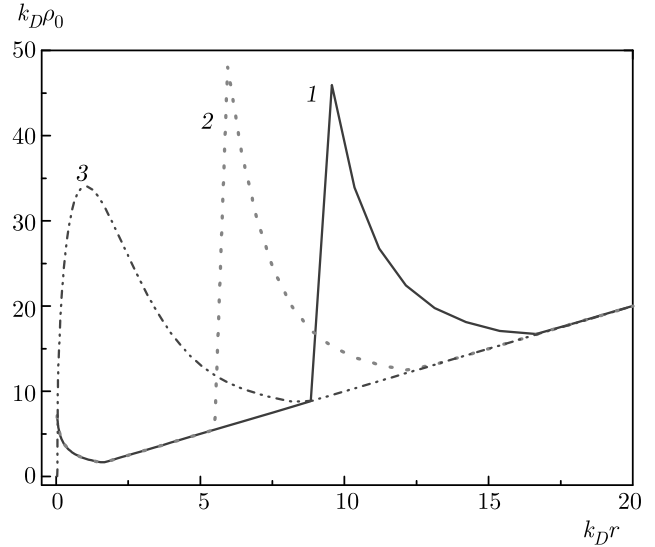


Рис. 2. Наибольший корень уравнения (10) в электрическом поле макрочастицы радиусом 1 мкм в изотермической плазме при  $E/N = 10^{-4}$  Тд при давлении 0.1 Па (1), 1 Па (2) и 10 Па (3) в аргоне

заряды  $\tilde{Q}_e$  и  $\tilde{Q}_i$  (это значение параметра будем далее обозначать как  $C_{0Q}$ ).

С ростом давления потенциал  $\phi_g(r)$  практически не меняется, а  $\phi_Q(r)$  растет пропорционально частоте столкновений. Это приводит к тому, что дебаевская часть потенциала  $\phi_D(r)$  становится меньше остальной части на меньших расстояниях. Отметим, что согласно [7, 10] в сильно столкновительном режиме поведение потенциала описывается суммой  $\phi(r) = \phi_D(r) + \phi_S(r)$ , где  $\phi_S$  — обусловленная стоками электронов и ионов на пылевую частицу часть потенциала в столкновительной плазме:

$$\phi_S(r) = -\frac{e \sum Q_{s\sigma}}{r} (1 - e^{-k_D r}), \quad (49)$$

$Q_{s\sigma}$  — эффективный заряд, определенный выражением

$$Q_{s\sigma} = \frac{z_\sigma m_\sigma \nu_\sigma S_\sigma}{k_D^2 T_\sigma}. \quad (50)$$

Из рис. 1 видно, что величина  $\phi_S(r)$  с ростом давления становится все выше и выше.

Расчеты в других газах показали аналогичное поведение распределений потенциала с максимумом величины  $\Theta(r)$  и линейным ростом на больших расстояниях при давлении выше 1 Па. Здесь обратим внимание на то, что в работе [41] отмечалось хорошее согласие распределений потенциала, рассчитанных из исходных кинетических уравнений Власова со столкновительным членом в форме Бхатнага-



**Таблица 1.** Потенциал поверхности пылевой частицы радиусом 1 мкм из уравнения (36), значение расчетного потенциала (36) при  $r = a$ , поток ионов из (38) и (39), значения величины  $C_0$  с зарядами  $\tilde{Q}_e$  и  $\tilde{Q}_i$  и с асимптотическими зарядами (35) в инертных газах при давлении  $p = 0.1$  Па и  $E/N = 10^{-4}$  Тд

Газ	$\phi_0$	$\phi(r = a)$	$S_i$ (38)	$S_i$ (39)	$C_{0Q}$	$C_0$ (35)
He	-0.079	-0.076	$1.60 \cdot 10^7$	$1.23 \cdot 10^7$	0.884	0.880
Ne	-0.096	-0.093	$8.30 \cdot 10^6$	$6.28 \cdot 10^6$	1.050	1.045
Ar	-0.103	-0.100	$6.25 \cdot 10^6$	$5.04 \cdot 10^6$	1.122	1.111
Kr	-0.111	-0.107	$4.58 \cdot 10^6$	$3.73 \cdot 10^6$	1.199	1.187
Xe	-0.116	-0.112	$3.79 \cdot 10^6$	$3.18 \cdot 10^6$	1.247	1.232

**Таблица 2.** Потенциал поверхности пылевой частицы из уравнения (36), значение расчетного потенциала (36) при  $r = a$ , поток ионов из (38) и (39), значения величины  $C_0$  с зарядами  $\tilde{Q}_e$  и  $\tilde{Q}_i$  и с асимптотическими зарядами (35) в инертных газах при давлении  $p = 0.1$  Па и  $E/N = 1$  Тд

Газ	$\phi_0$	$\phi(r = a)$	$S_i$ (38)	$S_i$ (39)	$C_{0Q}$	$C_0$ (35)
He	-0.853	-0.832	$1.34 \cdot 10^8$	$1.21 \cdot 10^8$	15.6	15.5
Ne	-5.644	-5.508	$3.86 \cdot 10^8$	$3.61 \cdot 10^8$	108.2	107.3
Ar	-4.229	-4.127	$2.06 \cdot 10^8$	$2.25 \cdot 10^8$	80.7	79.6
Kr	-4.179	-4.078	$1.41 \cdot 10^8$	$1.58 \cdot 10^8$	79.6	78.4
Xe	-3.718	-3.628	$1.00 \cdot 10^8$	$1.20 \cdot 10^8$	70.6	69.3

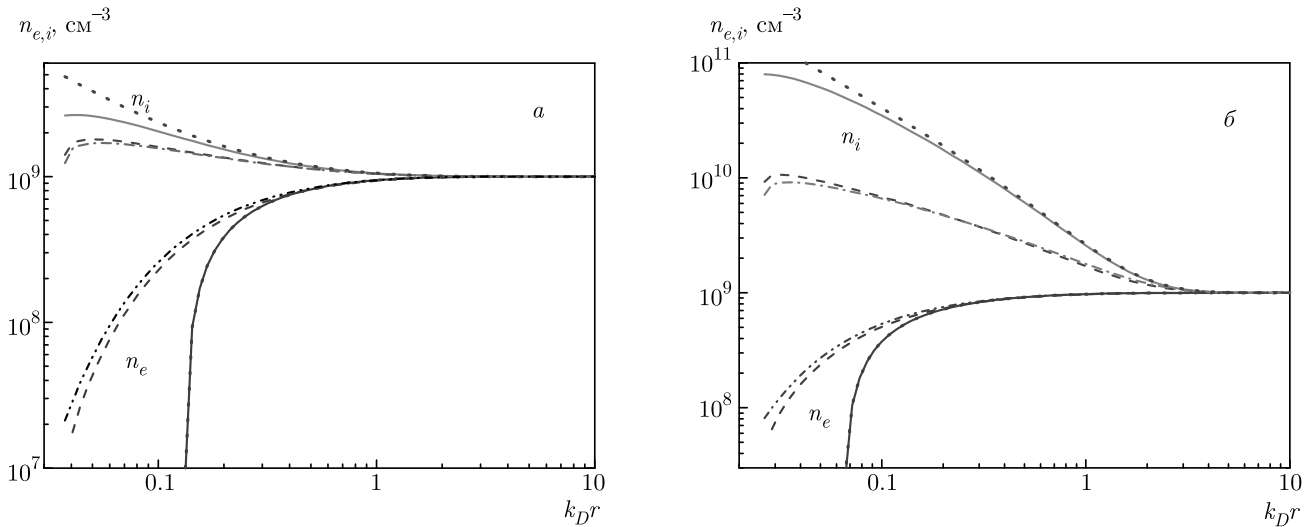
ра – Гросса – Крука (БГК) и в рамках линеаризованной теории [7].

На рис. 2 приведены зависимости наибольшего решения уравнения (10) при разных давлениях, найденные с использованием рассчитанных из (30) распределений потенциала. Видно, что при давлении аргона  $p = 0.1$  Па на малых расстояниях до  $k_D r \sim 10$  поведение  $\varrho_0$  соответствует дебаевскому потенциалу (см. [22]), причем при  $k_D r \geq (1 + \sqrt{5})/2$   $\varrho_0$  максимальное решение уравнения (10) достаточно быстро выходит на решение  $\varrho_0 = r$ , которое имеет место всегда. Далее начинается влияние растущей части величины  $\Theta(r)$ , что приводит к всплеску  $\varrho_0$  и последующему возврату на линию  $\varrho_0 = r$ . При  $p = 1$  Па этот всплеск сдвигается в сторону меньших расстояний, а при  $p = 10$  Па начинается прямо от поверхности пылевой частицы.

В табл. 1 и 2 приведены значения ряда величин в инертных газах при давлении  $p = 0.1$  Па в изотермической ( $E/N = 10^{-4}$  Тд) и неизотермической ( $E/N = 1$  Тд) плазме для пылевых частиц радиусом  $a = 1$  мкм. Видно, что потенциал поверхности пылевой частицы из уравнения (36) с потоками (38) (потенциал поверхности без учета барьеров для движения ионов) очень близок к значению расчетного

потенциала (30) при  $r = a$ , а поток ионов из выражения (38), обычно используемого при определении заряда в ПОО, и выражения (39) также оказываются близкими. При этом выражение (39) в изотермической плазме дает чуть меньшие значения, а в неизотермической плазме в аргоне, криптоне и ксеноне — чуть большие значения. Это находится в согласии с работой [41], в которой наблюдалось прохождение через максимум зависимости потока ионов от произведения длины свободного пробега ионов  $\ell_i$  на постоянную экранирования. В неизотермической плазме постоянная экранирования оказывается меньше примерно в  $\sqrt{2}$  раз (см. [10]), поэтому произведение  $k_D \ell_i$  во столько же раз уменьшается и в неизотермической плазме в аргоне, криптоне и ксеноне поток оказывается ближе к максимуму. Также интересно отметить близость значений параметров  $C_{0Q}$ , определенного с зарядами  $\tilde{Q}_e$  и  $\tilde{Q}_i$  (47), и  $C_0$ , вычисленного с асимптотическими зарядами из (35).

При увеличении давления до 1 Па близость потенциалов поверхности из уравнения (36) с потоками (38) и расчетного потенциала (30) при  $r = a$ , а также величин  $C_0$  и  $C_{0Q}$  сохраняется, а значения потока в тяжелых инертных газах начинают сильно расходиться (см. табл. 3). Еще большее расхождение



**Рис. 3.** Распределение концентрации электронов ( $n_e$ ) и ионов ( $n_i$ ) вокруг макрочастицы радиусом 1 мкм в изотермической плазме (а) и в неизотермической плазме при  $E/N = 1$  Тд (б) и давлении 0.1 Па в аргоне. Сплошные кривые — из (31), штриховые — из (12) с добавочным членом (19) или (20) для ионов и из (2) для электронов, пунктирные — линеаризация распределений Больцмана:  $n_\sigma(r) = n_{\sigma 0} [1 - e_{\sigma\phi}(r)/T_\sigma]$  (30), штрихпунктирные — модифицированное ПОО (22), штрихпунктирные с двумя точками — распределение Больцмана для электронов (1)

**Таблица 3.** Поток ионов на пылевую частицу радиусом 1 мкм в инертных газах при давлении  $p = 1$  Па

Газ	$E/N = 10^{-4}$ Тд		$E/N = 1$ Тд	
	$S_i$ (38)	$S_i$ (39)	$S_i$ (38)	$S_i$ (39)
He	$1.60 \cdot 10^7$	$2.01 \cdot 10^7$	$1.34 \cdot 10^8$	$1.14 \cdot 10^8$
Ne	$8.30 \cdot 10^6$	$1.07 \cdot 10^7$	$3.86 \cdot 10^8$	$4.33 \cdot 10^8$
Ar	$6.25 \cdot 10^6$	$1.10 \cdot 10^7$	$2.06 \cdot 10^8$	$4.97 \cdot 10^8$
Kr	$4.58 \cdot 10^6$	$8.58 \cdot 10^6$	$1.41 \cdot 10^8$	$3.81 \cdot 10^8$
Xe	$3.79 \cdot 10^6$	$2.04 \cdot 10^6$	$1.00 \cdot 10^8$	$3.33 \cdot 10^8$

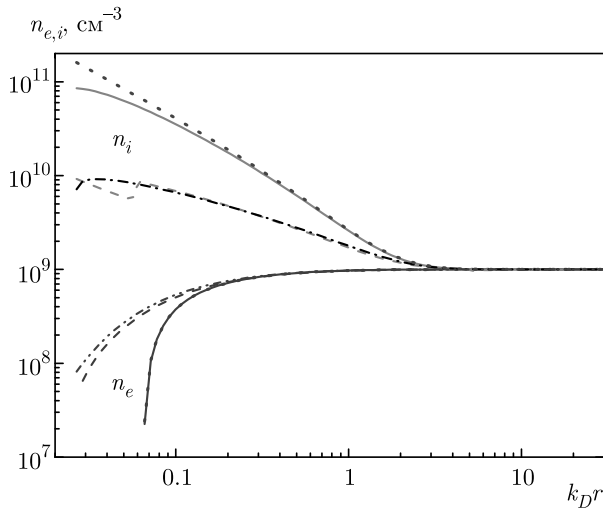
наблюдается при дальнейшем росте давления, что обусловлено растущей пропорционально давлению частью потенциала, имеющей кулоновскую зависимость. Поэтому возникает вопрос о точности определения потенциала поверхности пылевых частиц при давлениях выше 1 Па из уравнения (36) с потоками (38).

На рис. 3 приведены зависимости концентрации электронов и ионов в аргоне при давлении 0.1 Па. Видно, что уже при  $k_D r \leq 2$  начинается расхождение между распределениями ионов в рамках ЛКТЭ и ПОО. При этом распределение электронов в ЛКТЭ практически полностью описывается линеаризованным распределением Больцмана, а ионов

достаточно близко к нему. Отметим, что распределение электронов (2) в ПОО оказывается достаточно близким к распределению Больцмана (1), что связано с незначительностью потерь электронов из-за стока на пылевую частицу.

Сравнение распределений ионов, найденных в ПОО и из модифицированного выражения (22), показывает, что при давлении 0.1 Па они различаются незначительно как при  $E/N = 10^{-4}$  Тд, когда заряд пылевых частиц мал, так и при 1 Тд, когда заряд становится почти на два порядка выше (см. [10]). Это говорит о том, что при давлении 0.1 Па влияние потенциальных барьеров при приближении ионов к поверхности пылевой частицы незначительно.

При увеличении давления, как видно из рис. 4, на распределении ионов в ПОО на малых расстояниях появляются заметные нерегулярные отклонения, что связано с неприменимостью ни одного из рассмотренных в работе [22] случаев поведения потенциала при давлении выше 1 Па. При более высоких давлениях нерегулярное поведение распределения ионов только усиливается во всех рассмотренных в настоящей работе инертных газах. При этом выражение (22) позволяет рассчитать распределение ионов и при этих давлениях, но точность полученных значений концентрации ионов при этом остается неизвестной. В расчетах кинетических уравнений Власова со столкновительным членом в форме



**Рис. 4.** Распределение концентрации электронов ( $n_e$ ) и ионов ( $n_i$ ) вокруг макрочастицы радиусом 1 мкм в неизотермической плазме при  $E/N = 1$  Тд и давлении 1 Па в аргоне. Обозначения, как на рис. 3

БГК [49] было показано, что полученное распределение ионов при низких давлениях оказывается достаточно близким к распределению (22). Такой же вывод был сделан и в расчетах методом частиц в ячейках [50].

Близость распределений ионов и электронов в ЛКТЭ и линейризованных распределений Больцмана позволяет сделать вывод, что область применимости ЛКТЭ близка к области применимости теории Дебая – Гюккеля и ограничивается областью малых значений отношения потенциальной и тепловой энергии электронов и ионов.

### 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования распределения электронов и ионов вокруг заряженной пылевой частицы на основе линейризованной кинетической теории экранирования, включающей кинетические уравнения с самосогласованным полем, дополненные столкновительными интегралами в форме Бхатнагара – Гросса – Крука и точечными стоками электронов и ионов, показали ограниченную применимость приближения ограниченных орбит и ограниченную применимость линейризованной кинетической теории экранирования на основе уравнений Власова с учетом столкновений и стоков электронов и ионов. Сравнение полученных распределений электронов и ионов с результатами теории зондов в рамках приближения ограничен-

ных орбит показало, что последнее в инертных газах применимо только в пределе низких давлений, а с ростом давления кулоновская асимптотика потенциала, пропорциональная частоте столкновений электронов и ионов с нейтральными атомами (молекулами), делает неприменимыми формулы приближения ограниченных орбит для распределения ионов. Распределения электронов и ионов, полученные в рамках столкновительной кинетической модели точечных стоков, оказались близки к линейризованным распределениям Больцмана. Это позволяет сделать вывод, что область применимости столкновительной кинетической модели точечных стоков близка к области применимости теории Дебая – Гюккеля.

**Финансирование.** Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-12-10424).

### ЛИТЕРАТУРА

1. А. А. Власов, ЖЭТФ **8**, 291 (1938); УФН **93**, 444 (1967).
2. Л. Д. Ландау, ЖЭТФ **16**, 574 (1946); УФН **93**, 527 (1967).
3. N. S. Van Kampen, Physica **21**, 949 (1955).
4. А. Ф. Александров, Л. С. Богданкевич, А. А. Рухадзе, *Основы электродинамики плазмы*, Высшая школа, Москва (1988).
5. Б. Б. Кадомцев, *Коллективные явления в плазме*, Наука, Москва (1988), 304 с.
6. А. В. Тимофеев, *Резонансные явления в колебаниях плазмы*, Физматлит, Москва (2009), 296 с.
7. А. В. Филиппов, А. Г. Загородний, А. Ф. Паль, А. Н. Старостин, А. И. Момот, Письма в ЖЭТФ **86**, 873 (2007).
8. А. В. Филиппов, А. Г. Загородний, А. И. Момот, А. Ф. Паль, А. Н. Старостин, ЖЭТФ **131**, 164 (2007).
9. A. G. Zagorodny, Theor. Math. Phys. **160**, 1100 (2009).
10. А. В. Филиппов, А. Г. Загородний, А. И. Момот, А. Ф. Паль, А. Н. Старостин, ЖЭТФ **152**, 1088 (2017).
11. S. A. Khrapak, B. A. Klumov, and G. E. Morfill, Phys. Rev. Lett. **100**, 225003 (2008).

12. S. Khrapak and G. Morfill, *Contrib. Plasma Phys.* **49**, 148 (2009).
13. О. В. Козлов, *Электрический зонд в плазме*, Атомиздат, Москва (1969).
14. П. Чан, Л. Тэлбот, К. Турян, *Электрические зонды в неподвижной и движущейся плазме*, Мир, Москва (1978).
15. Б. В. Алексеев, В. А. Котельников, *Зондовый метод диагностики плазмы*, Энергоатомиздат, Москва (1988).
16. М. С. Бенилов, в сб. *Диагностика низкотемпературной плазмы*, под ред. М. Ф. Жукова, А. А. Овсянникова, Наука, Новосибирск (1994), с. 214–247.
17. M. S. Benilov, *J. Phys. D: Appl. Phys.* **33**, 1683 (2000).
18. V. I. Demidov, S. V. Ratynskaia, and K. Rypdal, *Rev. Sci. Instr.* **73**, 3409 (2002).
19. A. Autricque, S. A. Khrapak, L. Coulldel, N. Fedorczak, C. Arnas, J.-M. Layet, and C. Grisolia, *Phys. Plasmas* **25**, 063701 (2018).
20. D. Darian, S. Marholm, M. Mortensen, and W. J. Miloch, *Plasma Phys. Control. Fusion* **61**, 085025 (2019).
21. H. M. Mott-Smith and I. Langmuir, *Phys. Rev.* **28**, 727 (1926).
22. Ya. L. Al'pert, A. V. Gurevich, and L. P. Pitaevskii, *Space Physics with Artificial Satellites*, Plenum Press, New York (1965).
23. J. Allen, B. Annaratone, and U. de Angelis, *J. Plasma Phys.* **63**, 299 (2000).
24. X.-Z. Tang and G. L. Delzanno, *Phys. Plasmas* **21**, 123708 (2014).
25. В. Н. Цытович, *УФН* **167**, 57 (1997).
26. В. Е. Фортов, А. Г. Храпак, С. А. Храпак, В. И. Молотков, О. Ф. Петров, *УФН* **174**, 495 (2004).
27. V. E. Fortov, A. V. Ivlev, S. A. Khrapak, A. G. Khrapak, and G. E. Morfill, *Phys. Rep.* **421**, 1 (2005).
28. A. Ivlev, H. Löwen, G. Morfill, and C. P. Royall, *Series in Soft Condensed Matter*, Vol. 5, World Sci., Singapore (2012).
29. I. Mann, N. Meyer-Vernet, and A. Czechowski, *Phys. Rep.* **536**, 1 (2014).
30. А. В. Ивлев, С. А. Храпак, В. И. Молотков, А. Г. Храпак, *Введение в физику пылевой и комплексной плазмы*, Издат. дом Интеллект, Москва (2017).
31. F. Greiner, A. Melzer, B. Tadsen, S. Groth, C. Killer, F. Kirchsclager, F. Wieben, I. Pilch, H. Krüger, D. Block, A. Piel, and S. Wolf, *Eur. Phys. J. D* **72**, 81 (2018).
32. Л. Кедель, В. М. Носенко, С. Жданов, А. В. Ивлев, И. Лаут, Е. В. Яковлев, Н. П. Крючков, П. В. Овчаров, А. М. Липаев, С. О. Юрченко, *УФН* **189**, 1070 (2019).
33. A. A. Samarian and B. W. James, *Plasma Phys. Control. Fusion* **47**, B629 (2005).
34. И. С. Градштейн, И. М. Рыжик, *Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений*, Физматлит, Москва (1963).
35. E. Jahnke, F. Emde, and F. Lüsich, *Tables of Higher Functions*, McGraw-Hill, New York (1960); Nauka, Moscow (1977).
36. *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, ed. by M. Abramowitz and I. A. Stegun, Nat. Bureau of Standards, Appl. Math. Ser. **55** (1972).
37. M. Lampe, V. Gavrishchaka, G. Ganguli, and G. Joyce, *Phys. Rev. Lett.* **86**, 5278 (2001).
38. M. Lampe, R. Goswami, Z. Sternovsky, S. Robertson, V. Gavrishchaka, G. Ganguli, and G. Joyce, *Phys. Plasmas* **10**, 1500 (2003).
39. T. Bystrenko and A. Zagorodny, *Phys. Lett. A* **299**, 383 (2002).
40. С. А. Майоров, *Физика плазмы* **31**, 749 (2005).
41. I. L. Semenov, A. G. Zagorodny, and I. V. Krivtsun, *Phys. Plasmas* **19**, 043703 (2012).
42. A. V. Zobnin, A. D. Usachev, O. F. Petrov, and V. E. Fortov, *Phys. Plasmas* **15**, 043705 (2008).
43. А. В. Зобнин, А. П. Нефедов, В. А. Синельщиков, В. Е. Фортов, *ЖЭТФ* **118**, 554 (2000).
44. О. С. Ваулина, А. Ю. Репин, О. Ф. Петров, К. Г. Адамович, *ЖЭТФ* **129**, 1118 (2006).
45. L. G. D'yachkov, A. G. Khrapak, S. A. Khrapak, and G. E. Morfill, *Phys. Plasmas* **14**, 042102 (2007).
46. I. H. Hutchinson and L. Patacchini, *Phys. Plasmas* **14**, 013505 (2007).

- 
47. S. A. Khrapak and G. E. Morfill, *Phys. Plasmas* **15**, 114503 (2008).
48. I. Pilch, L. Caillault, T. Minea, U. Helmersson, A. A. Tal, I. A. Abrikosov, E. P. Münger, and N. Brenning, *J. Phys. D: Appl. Phys.* **49**, 395208 (2016).
49. I. L. Semenov, A. G. Zagorodny, and I. V. Krivtsun, *Phys. Plasmas* **18**, 103707 (2011).
50. G. L. Delzanno and X.-Z. Tang, *Phys. Plasmas* **22**, 113703 (2015).